

ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  $\alpha$ -GeSi:H

М.Я. БАКИРОВ, М.А. МАМЕДОВ

Сектор Радиационных Исследований АН Азербайджана  
370143, г.Баку, пр. Г.Джавида, 31а

Исследовалось влияние водорода на оптические свойства  $\alpha$ -GeSi:H. Показано, что при введении водорода в  $\alpha$ -GeSi:H ширина запрещенной зоны увеличивается, а число парамагнитных центров уменьшается. Установлено, что с ростом содержания кремния ширина запрещенной зоны увеличивается от 1,15 эВ до 1,86 эВ, что позволяет выбрать оптимальный состав для изготовления солнечных элементов.

В последние годы интерес к аморфным полупроводникам, которые используются для изготовления солнечных элементов, возрос. Одним из перспективных материалов для этой цели является аморфная пленка твердого раствора германий-кремний. Гидрогенизированные аморфные твердые растворы германий-кремний ( $\alpha$ -GeSi:H) обладают высокой проводимостью и коэффициентом поглощения в видимой области спектра, а также, по сравнению с другими аморфными полупроводниками, являются термодинамически стабильными и радиационно стойкими.

В литературе имеется ряд работ [1-4], посвященных исследованиям оптических свойств  $\alpha$ -GeSi:H. Однако, влияние водорода и состава сплава на оптическую ширину запрещенной зоны изучено недостаточно.

Цель настоящей работы заключалась в исследовании оптических свойств пленок  $\alpha$ -GeSi:H. Основное внимание было обращено на получение информации об оптической ширине запрещенной зоны и влияние состава на  $E_g$ .

Пленки  $\alpha$ -GeSi:H были получены распылением германово-кремниевой мишени в атмосфере газовой смеси аргона и водорода. Состав пленки варьировался путем изменения площади компонентов, а концентрация водорода - изменением состава газовой смеси. В качестве подложки использовался плавленый кварц. При распылении подложка была нагрета до 200 °C, и скорость осаждения менялась от 15 до 20 Å/сек. Толщина полученных пленок составляла 1-3 мкм. При изучении влияния водорода на край оптического поглощения и ширину запрещенной зоны, пленки имели постоянный состав  $\text{Ge}_{0.9}\text{Si}_{0.1}$ , а при изучении влияния состава - концентрация водорода составляла 20 ат. %.

На рис. 1 показаны кривые поглощения  $\alpha$ -Ge<sub>0.9</sub>Si<sub>0.1</sub>:H. Видно, что с увеличением содержания водорода в растворе, край поглощения смещается в сторону более высокой энергии фотона, и, для всех исследованных образцов, оптическое поглощение удовлетворительно описывается соотношением

$$\alpha h\nu = B (h\nu - E_g)^2,$$

где  $B$  - коэффициент пропорциональности,  $E_g$  - ширина запрещенной зоны,  $\alpha$  - коэффициент поглощения,  $h\nu$  - энергия фотона.

Установлено, что оптическая ширина запрещенной зоны с увеличением содержания водорода в растворе сначала растет линейно, а затем стремится к насыщению (рис. 2, кривая 1). Исходя из этого, в дальнейшем содержание водорода в  $\alpha$ -GeSi поддерживалось постоянным около 20 %.

В соответствии с общепринятым утверждением, смещение края оптического поглощения и увеличение ширины запрещенной зоны с ростом содержания водорода в аморфных пленках обусловлены нейтрализацией образованных связей в неупорядоченной сетке. Полагается, что атомы германия и кремния в процессе конденсации на подложку формируют преимущественно четырех координатную тетрагидридическую сетку, подобно структурной сетке аморфного германия и аморфного кремния. Валентные углы и длины связей на каждом углу структурной сетки деформированы, что является непременным условием аморфной структуры.

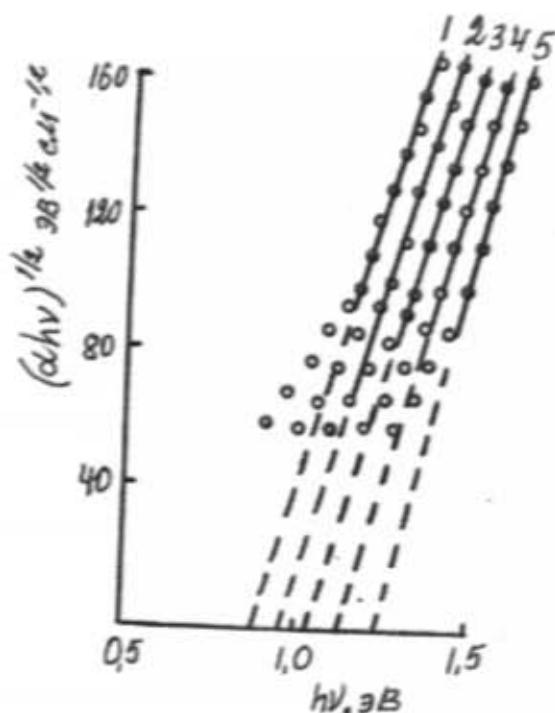


Рис. 1. Край оптического поглощения  $\alpha$ -Ge<sub>0.9</sub>Si<sub>0.1</sub>:H  
 $X_H$  ат. %: 1-1,5; 2-5; 3-9; 4-14; 5-23.

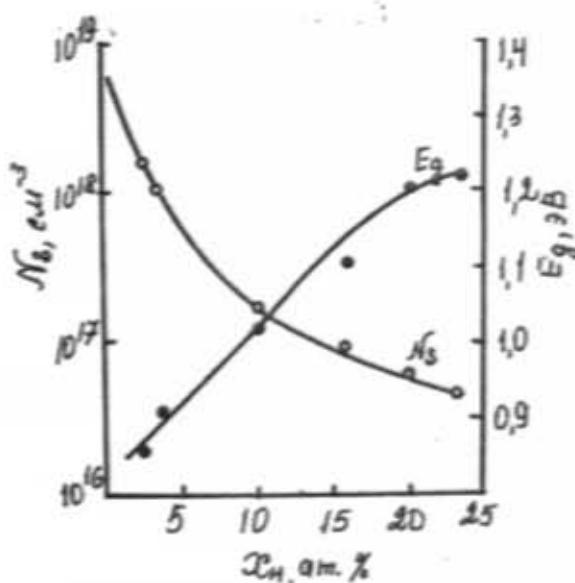


Рис. 2. Зависимость ширины запрещенной зоны и концентрации парамагнитных центров в  $\alpha$ -Ge<sub>1-x</sub>Si<sub>x</sub>:H от H<sub>x</sub>: 1-E<sub>g</sub>, 2-N<sub>p</sub>.

ЭПР измерения показали, что структурная сетка  $\alpha$ -GeSi имеет деформированные узлы, которые содержат в своем ближайшем окружении лишь три атома. Требуемый для построения тетраздрического ближнего порядка четвертый атом, в силу структурных флюктуаций в аморфной фазе, оказывается пространственно удаленным и в химическую связь не вступает. Таким образом, на деформированном узле образуются дефекты, которые создают локальные уровни в щели подвижности. При введении водорода увеличивается сила связи в сетке вследствие того, что энергия связи Ge-H и Si-H примерно на 0,5-0,6 эВ больше, чем энергия связей Ge-Ge, Si-Si и Si-Ge. Атомы водорода, будучи одновалентными, насыщают оборванные связи и пассивируют их, и это неизбежно находит свое отражение в крае оптического поглощения и величине ширины запрещенной зоны.

Предполагается, что в негидрогенизованных пленках, вследствие малой протяженности волновой функции, на единичном локализованном уровне в щели подвижности находится только один электрон, и поэтому центр является парамагнитным. При наличии второго электрона (от атома водорода) возникает уровень, который лежит вне щели подвижности. Поэтому, при введении водорода ширина запрещенной зоны увеличивается, а концентрация парамагнитных центров уменьшается, что было доказано экспериментально (рис. 2, кривая 2). Найдено, что в образах без водорода  $N_p = 10^{19} \text{ см}^{-3}$ , а в образах с 20 ат. % водорода  $N_p = 8 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-3}$ . Несмотря на избыток водорода в структурной сетке, определенная часть обор-

ванных связей остается некомпенсированной. По данным ЭПР исследований плотность таких связей снижается до  $10^{16} \text{ см}^{-3}$ . Однако и этого достаточно, чтобы на фоне собственных уровней решетки был замечен эффект внедрения примеси.

Одной из специфических особенностей твердого раствора GeSi является изменение ширины запрещенной зоны с составом, что позволяет выбрать материал с оптимальной шириной запрещенной зоны для изготовления эффективных солнечных элементов.

Для  $\alpha$ -Ge<sub>1-x</sub>Si<sub>x</sub>:H различного состава ( $x_{\text{Si}}=20$  ат. %) изучены спектры оптического поглощения и установлено, что с увеличением концентрации кремния край поглощения смещается в сторону большей энергии фотона (рис. 3), что означает увеличение энергетического зазора между валентной зоной и зоной проводимости. Определено, что с ростом содержания кремния от 0 до 100 % в  $\alpha$ -Ge<sub>1-x</sub>Si<sub>x</sub>:H ширина его запрещенной зоны линейно увеличивается от 1,15 эВ до 1,86 эВ, что можно описать выражением  $E_g = 1,15 + 0,71 C_{\text{Si}}$ , где  $C_{\text{Si}}$  изменяется в интервале от 0 до 1.

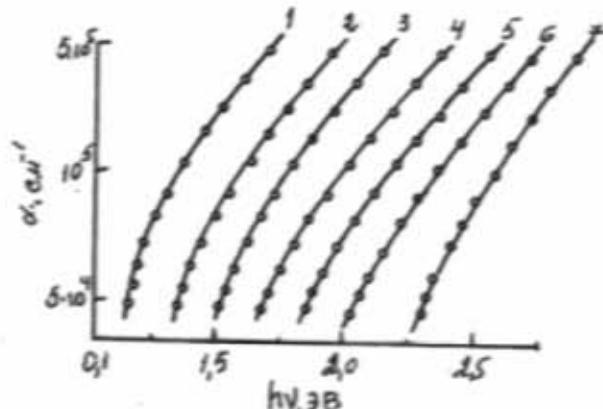


Рис. 3. Кривые поглощения в  $\alpha$ -Ge<sub>1-x</sub>Si<sub>x</sub>:H.  $x_{\text{Si}}$  ат. %: 1-0; 2-0,1; 3-0,25; 4-0,5; 5-0,6; 6-0,75; 7-1,0.

Предполагается, что атомы кремния встраиваются в узлы неупорядоченной сетки  $\alpha$ -Ge. Это приводит к снижению механических напряжений в ней, к уменьшению длины связей и отклонению валентных углов, т.е. к такой атомной перестройке, которая способствует снижению концентрации оборванных связей и других дефектов. Это в свою очередь, приводит к уменьшению плотности локализованных состояний в щели подвижности, увеличению запрещенной зоны и уменьшению темновой проводимости.

Полученные результаты представляют интерес с точки зрения создания солнечных элементов на основе  $\alpha$ -GeSi:H.

- [1] Saito, K. Aoki, H. Sannomiya, T. Yamaguchi. Thin Sol. Films 1984, v.115, p.253-262
- [2] Хахлов, А.Е. Машин, А.И. Ершов, Ю.А. Мордвинов, И.И. Машин. ФТП, 1986, т.20, вып. 7, с.1288-1291
- [3] Юкимото. В кн."Аморфные полупроводники и при-

- боры на их основе", М. Металлургия, 1986, 376 с.
- [4] Nayafov, M. Ya. Bakirov, V.S. Mamedov, A.A. Andreev. Phys. Stat. Sol.(a), 1991, v.123, K67-K70
- [5] Midda, De S.C. and Swami Ray. J. Appl. Phys., 1993, v.79, № 9, p.4622-4629

M.Y. Bakirov, M.O. Mamedov

**$\alpha$ -GeSi:H BÖRK MƏHLULUNUN OPTİK XASSƏLƏRİ**

Məqalədə  $\alpha$ -GeSi:H nazik lövhələrinin optik xassələrinə mehlul tərkibinin və hidrogenin tə'siri araşdırılmışdır. Gösterilmişdir ki,  $\alpha$ -GeSi bekri mehluluna hidrogen daxil edildikdə qadağan olunmuş zonanın eni böyütür, paramaqnit mərkəzlerin sayı isə azalır. Müəyyən olunmuşdur ki, mehlulda silisiumun miqdarının artması ilə qadağan olunmuş zonanın eni 1,15 eV-dan 1,86 eV-ə qədər artır. Bu da gilənəş elementlərinin hazırlanması üçün optimal tərkibin seçilməsinə imkan verir.

M.Y. Bakirov, M.A. Mamedov

**OPTICAL PROPERTIES  $\alpha$ -GeSi:H**

The influence of hydrogen and alloy composition on optical properties of  $\alpha$ -GeSi:H has been studied. It's shown that at hydrogen introduction to  $\alpha$ -GeSi forbidden gap increases, and number of paramagnetic centers decreases. It is established that with growing content of Si forbidden gap increases from 1,15 eV to 1,86 eV what allows to choose an optimum composition for construction solar elements.

*Даты поступления 14.05.96*

*Редактор: М.Г. Шахстаминский*